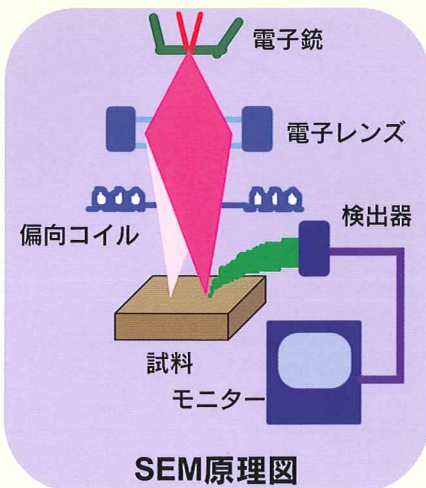
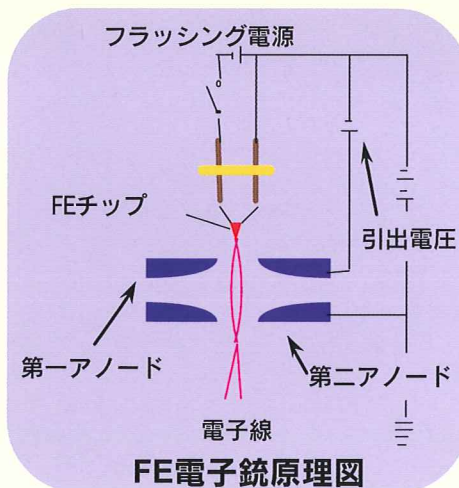


電界放出型 走査型電子顕微鏡
FE-SEM (Field Emission Scanning Electron Microscope)

原理



SEM原理図

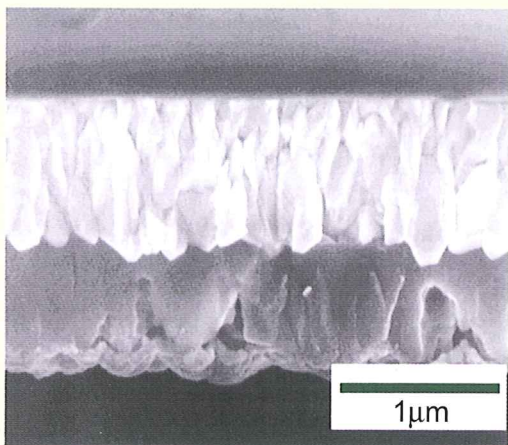


FE電子銃原理図

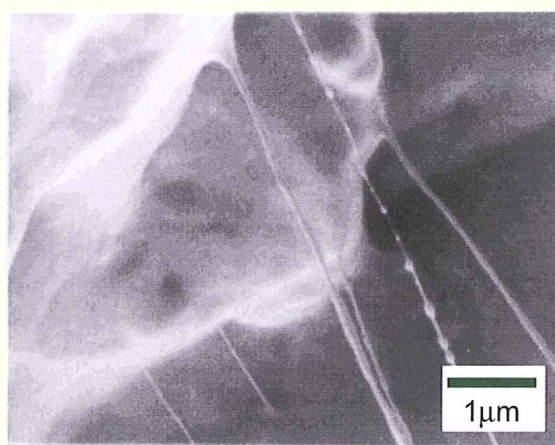
FEのメリット
 電子プローブ径が小さい
 高分解能
 低加速電圧で観察可能
 試料ダメージ
 帯電を防止
 極微小凹凸が観察可能

特長

- 最表面情報を、無蒸着でチャージアップなしで観察可能
- 低加速電圧 (1kV) においては4.0nm、15kVにおいては1.5nmの高分解能
- EDX分析装置を付属
- 大型ウェハなどに対応する6インチ径の大型試料交換室



太陽電池断面
(加速電圧5kV、無蒸着)



PP破断面
(加速電圧0.6kV、無蒸着)

株式会社 三井化学分析センター

<http://www.mcanac.co.jp>

営業部 ☎ 03-5524-3851